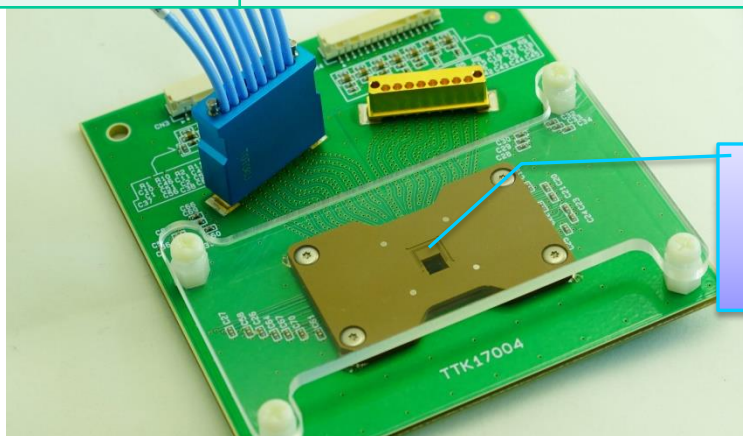


## 高周波プローブカード

高周波IC計測治具はICの複数電極に直接コンタクトして、  
計測機に直結出来る検査治具です。

### 構造・仕様

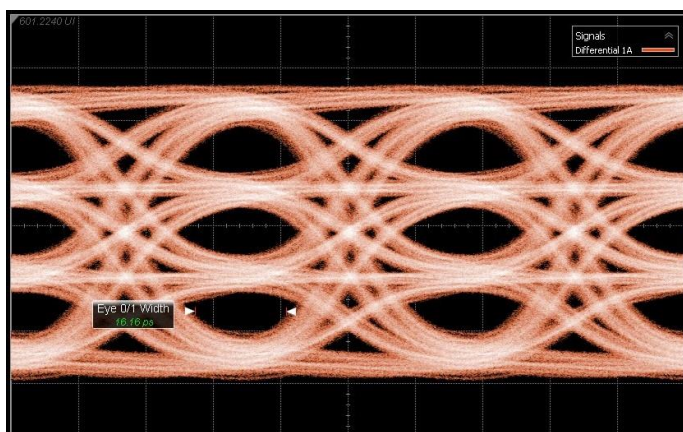
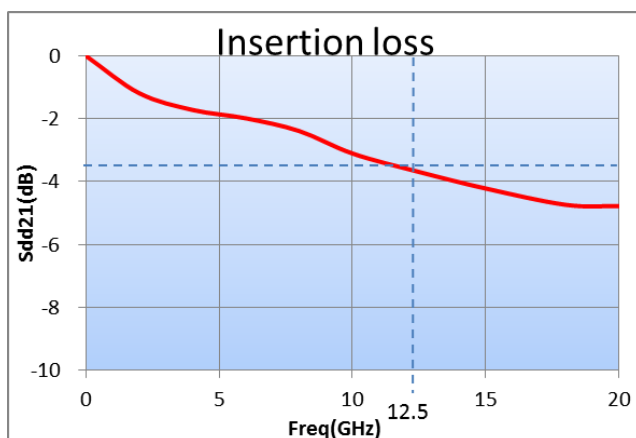
配線パターン	高周波信号 ; ~ 8 対差動接続 電源、他 ; ~40芯
寸法	(縦)X(横)X(高さ) ; 100mmx100mmx20mm以下
測定物仕様	最小電極間距離 ; 150μm



IC以外にも測定対象物に  
合わせた高周波測定が  
可能です。  
先ずにご相談ください。

### 電気特性

InsertionLoss	下図参照 (Sdd21、8対平均)
Eye Pattern	下図参照 (50Gbps実測値)



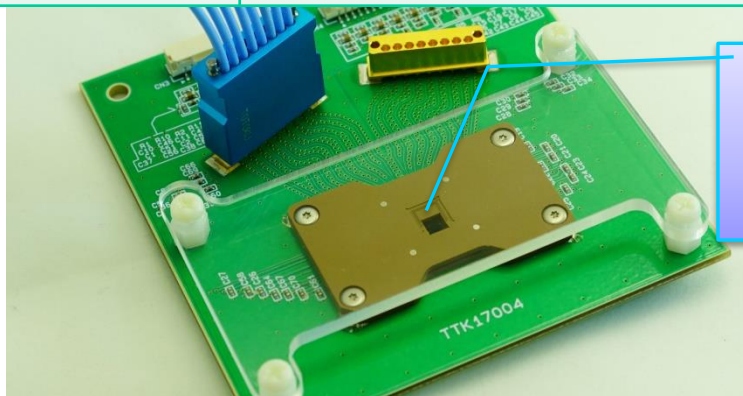
## High frequency probe card

Direct connection to IC

Direct connection to measuring instruments

### Structure / Specifications

Wiring pattern	high frequency signal ; ~8-pair differential connection power supply, etc. ; ~40 pin
Size	(L)X(W)X(H) ; 100mmx100mmx20mm
Measurement object	minimum inter-electrode distance ; 150μm



It is possible to measure high frequencies according to the object to be measured. Please contact us first.

### Electrical properties

InsertionLoss	Fig.1 (Sdd21)
Eye Pattern	Fig.2 (25Gbaud PAM4)

